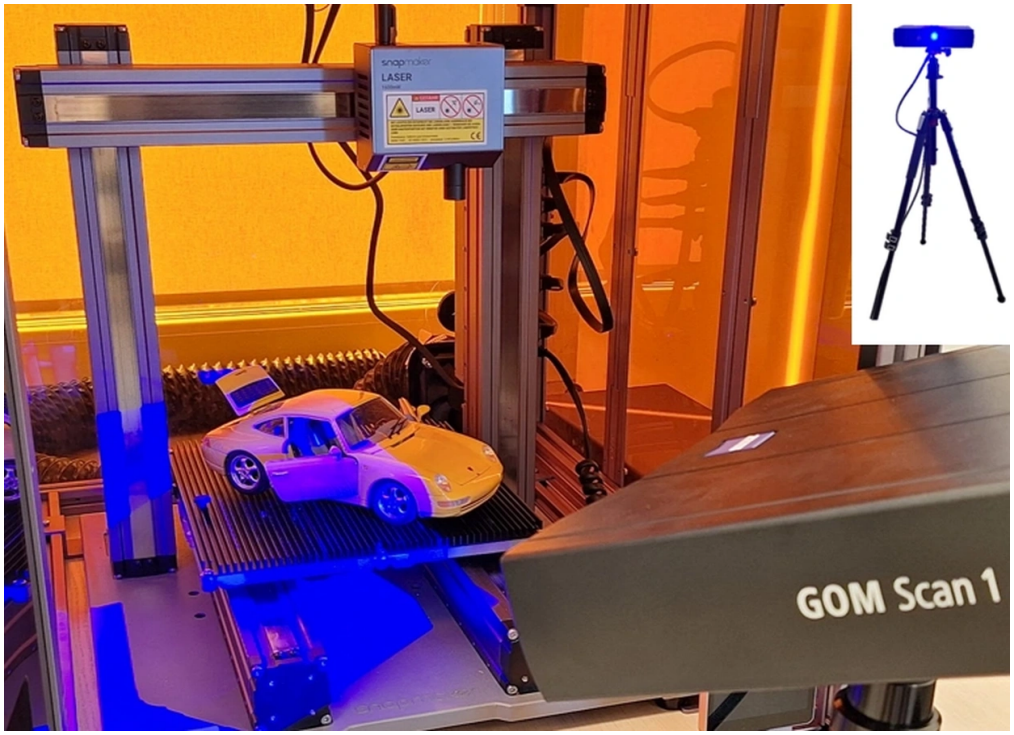
Oferta Badawcza AGH

Skaner 3D - Gom2



Opis techniczny:

Skaner bezstykowy GOM Scan 1 to zaawansowane urządzenie oparte na technologii niebieskiego światła oraz projekcji prążków GOM stosowane w inżynierii odwrotnej do cyfryzacji analizowanych wyrobów i obiektów. GOM Scan 1 jest wyposażony w zaawansowaną technologie Blue Light od firmy GOM i działa na zasadzie kamery stereoskopowej co zapewnia wysoką precyzję pozyskiwania danych 3D.

Nazwa handlowa: System pomiarowy GOM Scan 1 200

Więcej szczegółów: /equipment/skaner-3d-gom2/

Rodzaj dostępu: Zewnętrzna

Rodzaj akredytacji / certyfikatu: Certyfikat

Osoba kontaktowa: Perzyński Konrad

Osoba kontaktowa - adres strony www: https://skos.agh.edu.pl/osoba/konrad-perzynski-7420.html

Jednostka odpowiedzialna: Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania

Grupa / laboratorium / zespół: Grupa Badawcza Cyfryzacji Przemysłu i Modelowania Wieloskalowego (Digitaris) / Laboratorium Inżynierii Odwrotnej i Wirtualnej Rzeczywistości

Data ostatniej aktualizacji: 11 października 2023 10:12

Rok wprowadzenia do użytkowania: 2023

Obszary badawcze IDUB:

(POB 2) Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy
(POB 4) Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. Zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano
(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną

Możliwości badawcze:

Skanowanie obiektów 3D. Przetwarzanie i analiza danych ze skanera. Inżynieria odwrotna. Szybkie prototypowanie. Przygotowanie do komputerowego wspomagania projektowania technologii. Przeprowadzanie kontroli jakości skanowanej części.

Możliwości pomiarowe:

Rozdzielczość kamer: 6 Mpx Błąd pomiarowy: 0.003 mm Obszar pomiarowy: 200 x 125mm. Możliwość łączenia wielu obszarów pomiarowych w jeden obiekt. Odległość od miejsca pomiaru: 450mm Źródło światła: LED Oprogramowanie do obróbki skanów: Inspect Suite Temperatura pracy: -20 do 55°C

Warunki udostępniania infrastruktury:

Udostępnianie infrastruktury wyłącznie za pośrednictwem upoważnionego pracownika Katedry Informatyki Stosowanej i Modelowania. Zlecenie/ umowa/inna forma współpracy po uzgodnieniu.